

2号炉 放射化汚染, 二次的な汚染の工程について(更新)

令和3年2月5日
中国電力株式会社

| 項目 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|---------------|---|----------------|---|--------|--------|----|----|
| | | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 |
| 放射化汚染 | サンプリングの実施 場所: 1号炉タービン建物3階 採取: ポリ瓶1本 | 準備※1 | 2号炉からのサンプリング 低圧ダイヤフラム第7段噴出口×1個 低圧内部車室入口側×1個 | (完了) | | | |
| | 分析方法検討 | 手順書案作成 | 検出限界値検討※2 予備サンプル(低圧ダイヤフラム)試験※3 | (完了) | | | |
| | 分析の実施 (低圧内部車室入口側の追加) | | 2号炉の分析※4 低圧ダイヤフラム第7段噴出口×1個 低圧内部車室入口側×1個 | (実施中) | | | |
| 二次的な汚染 | サンプリングの実施 場所: 1号炉タービン建物3階 採取: ポリ瓶1本 (低圧内部車室入口側の追加) | 準備※1 | 2号炉からのサンプリング※5 低圧ダイヤフラム第7段噴出口×2個(除染前後) 低圧内部車室入口側×2個(除染前後) | (実施中) | | | |
| | 分析の実施 (低圧内部車室入口側の追加) | | 2号炉の分析※6 低圧ダイヤフラム第7段噴出口×2個(除染前後) 低圧内部車室入口側×2個(除染前後) | (今後実施) | | | |
| 表面汚染密度分布(追加) | | | 低圧ダイヤフラム: 軸方向及び周方向の測定 低圧内部車室: 軸方向及び周方向の測定 | (実施中) | | | |
| 基本ロジック(エビデンス) | | | | | 提出▽ | | |
| 不確かさ等 | GMサーベイメータの不確かさ 測定単位, 評価単位 | JISの不確かさ調査 | | | | | |
| | | 測定, 評価単位の現場調査等 | | | 記載案の検討 | | |

※1: 資機材(切断装置等), 消耗品(ポリ瓶, 養生シート等)の準備, 発電所内のQMS手順書に基づく承認手続き(安全対策関係の作業承認等) (完了)

※2: 予備サンプルを用いてCo-60の検出限界値について1/33を達成できる見込みが得られた(完了)。1/66は分析しながら検討する。

※3: 酸により予備サンプルを溶解~Ge半導体検出器測定を行う。(完了)

※4: 検討した手順書により分析を実施する。1サンプルあたり溶解(5日程度), Ge測定(2日程度)

※5: サンプリング: 低圧ダイヤフラム第7段噴出口×2個, 低圧内部車室入口側×1個(完了)

プラスト除染装置による除染: 除染装置のメンテナンス(5日程度), 低圧ダイヤフラム第7段噴出口×1個, 低圧内部車室入口側×1個の除染(10日程度)